



FH MÜNSTER  
University of Applied Sciences

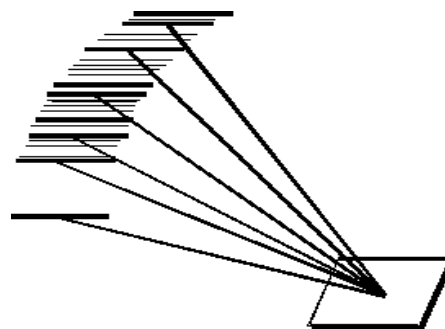


**31.**

# **Anwendertreffen Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie**

Technologie-Campus  
Steinfurt

03. – 04. März 2026



Die FH Münster veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie (DAAS) ein Treffen von Anwendern der Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie sowie verwandter Methoden der Feststoffanalyse.

Ziel des Anwendertreffens ist es, Forschung und Industrie zusammenzuführen, um den Informationsaustausch zu fördern und neue Entwicklungen anzuregen. In Kurzvorträgen wird über instrumentelle Neuentwicklungen, Lösungen aktueller Fragestellungen und insbesondere über den Einsatz dieser Methoden in Laboratorien verschiedener Industriezweige berichtet. Alle führenden Hersteller und Dienstleister auf diesem Gebiet sind vertreten.

#### **Tagungsort:**

**FH Münster  
Technologiecampus Steinfurt  
Gebäude S  
Stegerwaldstraße 39  
48565 Steinfurt**

#### **Organisation**

**Prof. Dr. M. Kreyenschmidt  
M. Sc. S. Hanning**

**Dr. J. Flock  
Dr. E. Pappert**

#### **Informationen und Online-Anmeldung unter [FH.MSAWT](http://FH.MSAWT)**

#### **Kontakt:**

**[M. Sc. Stephanie Hanning](mailto:awt@fh-muenster.de)**

**FH Münster**  
Fachbereich Chemieingenieurwesen  
Instrumentelle Analytik  
Stegerwaldstr. 39  
48565 Steinfurt  
Fax 02551 962 429  
**E-Mail [awt@fh-muenster.de](mailto:awt@fh-muenster.de)**

**Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 9 Uhr.**

**Die Vorträge werden nach Abschluss der Veranstaltung für alle angemeldeten Teilnehmer zum Download bereitgestellt.**

### **03. März 2026 ab 9 Uhr**

#### **Heinz-Gerd Joosten**

Funke versus Laser: Status quo und Versuch eines Ausblicks

#### **Martin Tillemann (TAZ)**

Warum der DAkkS Kalibrierschein nicht nur für den Auditor wichtig ist – Überraschungen am Funkenspektrometer

#### **Stefan Wieler (QUAISO)**

DIN EN ISO/IEC 17025 im Fokus: Herausforderungen bei der Akkreditierung der Funkenemissionsspektrometrie und Röntgenfluoreszenzanalyse

#### **Philipp Gründkern (SciApp)**

Flüssigkeitsanalytik mittels HH-LIBS: LAC und LSC

#### **Wilhelm Sanders (Thermo Fisher Scientific)**

Verbesserung der analytischen Leistungsfähigkeit bei der Metallcharakterisierung mit der „Mass-box“-Technologie

#### **Gero Sinha (SUS Nell)**

Die Evolution der Rekalibrierproben

#### **Niklas Willems (KETEK)**

Neueste Entwicklungen bei Silizium-Drift-Detektoren und Anwendungsbeispiele

#### **Adrian Fiege (Bruker)**

Eine kleine Revolution für WD-RFA: Neue Detektoren und Signalverarbeitung für Geschwindigkeit

#### **Jonas Lauer-Heck (Institut für Arbeitsschutz DGUV)**

TXRF im Arbeitsschutz - Spurenanalyse von Cu, Zn, Pb, Mn, Cr, Co und Ni in der Luft am Arbeitsplatz

#### **Tobias Gantenberg (Hochschule Niederrhein)**

Feinstaubanalytik von Emissionen in verschiedenen Anwendungsbereichen und Präzision

#### **Saskia Kerkeling (FH Münster)**

Ortsaufgelöste Analyse von PVC-Materialien

#### **Reza Hosseinabadi (Hitachi)**

Einfluss der Probenvorbereitung auf Messergebnisse von Handheld-RFA-Geräten im Feld

#### **Frederic Davidts (XRF Scientific)**

XRF analysis & Loss of Ignition (LOI)

**Markus Krämer** (Axxo Dresden)

Röntgenfluoreszenz im Streiflicht – Mit GIXRF von der Oberfläche bis in Nanometer-Tiefe

**Jonathan M. Kranz** (TU Berlin)

Optimierte Polykapillarlinsen für hochaufgelöste full-field RFA

## **04. März 2026 ab 9 Uhr**

**Martin Lischka** (Herzog Maschinenfabrik)

Sensoroptimierte Probenvorbereitung für die XRF

**Dirk Töwe** (HRT)

Effiziente Probenvorbereitung für die RFA-Analytik

**Rainer Schramm** (Fluxana)

Schmelzaufschluss – Weiterentwicklung für die Zukunft

**Dirk Wissmann** (Spectro)

Analyse von Magneten, Einsatz der ED-RFA in der Qualitätskontrolle und beim Recycling

**Benjamin Thomas** (Shimadzu)

Bestimmung von Fluor in Schlacke mittels Energie-dispersiver Röntgenfluoreszenzspektroskopie

**Yasemin Oguz** (Hochschule Niederrhein)

Schwertmetalle und Mikroplastik in Getreide

**Volker Hückelkamp** (Spectro)

ED-RFA im Einsatz bei der Optimierung elektrolytischer Raffinationsprozesse und galvanischer Bäder

**Daniel Sachtler** (Malvern Pananalytical)

Präzisionsanalytik von Edelmetallen mit der RFA

**Ernst Hinteregger** (Treibacher)

Selten? Aber sicher nicht bei uns! - Aspekte bei der Analyse von Seltenen Erden und Actinoide

**Jan Stelling** (Bruker)

Wie neue Wege der WD-RFA-Datenauswertung konventionelle Methoden vereinfachen und beschleunigen

**Jürgen Schram** (Hochschule Niederrhein)

Analytik in antiquarischen Büchern

**Oleksandra Marushchenko** (Helmholtz-Zentrum Berlin)

Wie Zink in Zähnen wandert - Einblicke mittels RFA auf verschiedenen Längenskalen

**Ling Schneider** (Thermo Fisher Scientific)

Boosting efficiency in Elemental Analysis with the ARL X900 spectrometer: Precision, Speed, and Reliability

## Anfahrtsbeschreibung

Das AWT findet am Technologie-Campus Steinfurt der FH Münster statt. Die Lage der Parkplätze (P1-P5, Ersatzparkplätze) und des Veranstaltungsgebäudes (Gebäude S) entnehmen Sie bitte dem Lageplan und der Ausschilderung vor Ort.

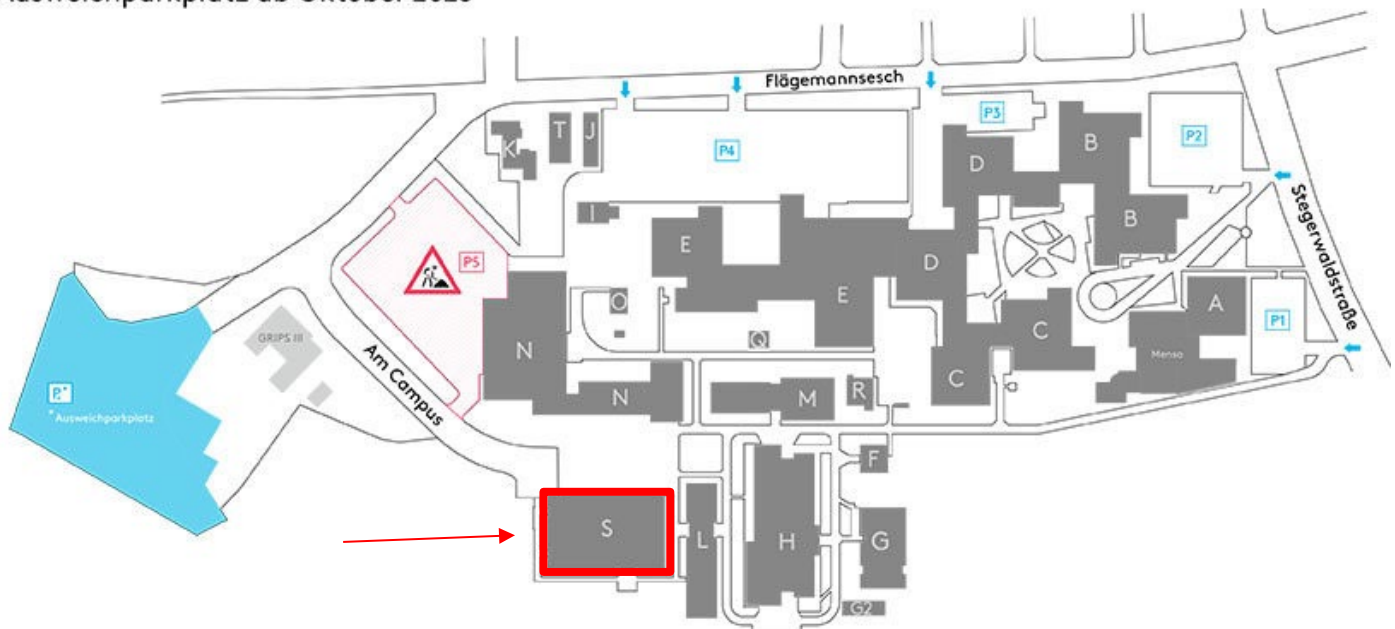
Sollten Sie mit dem Zug anreisen, gibt es einen Bustransfer vom Bahnhof Steinfurt zum Campus an der Stegerwaldstraße. Der Fußweg vom Bahnhof bis zum Campus beträgt ca. 7 Minuten.

## Abendveranstaltung:

Traditionell treffen wir uns zu einem „Get-together“ am ersten Abend des AWT in einer Steinfurter Gastronomie. Bitte melden Sie sich gerne an der Anmeldung dazu an.

## Campus Steinfurt (CST)

Stegerwaldstraße 39, 48565 Steinfurt  
Ausweichparkplatz ab Oktober 2023



Aktuelle Informationen finden Sie unter: [FH.MS\AWT](https://www.fh-muenster.de/MS/AWT)